

## НЕЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЗЕЕМАНОВСКОМ ИОННОМ ЛАЗЕРЕ

С.А.Бабин, С.И.Каблуков, М.А.Кондратенко, Д.А.Шапиро<sup>1)</sup>

Институт автоматики и электрометрии Сибирское отделение РАН  
630090 Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 11 июля 1996 г.

Зарегистрирован и исследован узкий интерференционный резонанс в зависимости мощности однододового ионного лазера от магнитного поля. Выполнен расчет нелинейного интерференционного эффекта в зеемановском лазере с учетом кулоновской диффузии в пространстве скоростей. Обнаружено значительное изменение формы двухфотонного резонанса по сравнению с бездиффузионным случаем.

PACS: 32.60.+i, 32.70.Jz, 42.62.Fi

Методы нелинейной спектроскопии, благодаря своей высокой чувствительности, широко применяются в исследованиях атомных и молекулярных переходов в условиях большого доплеровского уширения. Нелинейная спектроскопия ионов в плазме имеет ряд принципиальных отличий, связанных как с многочастичным характером кулоновского взаимодействия заряженных частиц [1], так и с влиянием внешних электрических и магнитных полей на движение ионов [2, 3]. Одним из ярких проявлений плазменной специфики является обнаруженное уширение в 2–4 раза провала Лэмба (эффект насыщения) в аргоновых лазерах за счет кулоновского ион-ионного рассеяния (см. [4] и цитируемую там литературу). Наряду с насыщением, в нелинейных спектрах можно наблюдать также нелинейный интерференционный эффект (НИЭФ), вызванный смешиванием квантовых состояний полем световой волны. Вопрос о влиянии интерференции на спектры ионов в плазме исследован менее детально. В работе [5] найдено асимптотическое разложение работы пробного поля в трехуровневой системе в пределе сильной диффузии и показано, что двухфотонный пик приобретает форму квадратного корня из лорентцевского профиля

$$\operatorname{Re}[Dk^2(\Gamma - i\varepsilon)]^{-1/2} \sim \left( \frac{\Gamma + (\Gamma^2 + \varepsilon^2)^{1/2}}{\Gamma^2 + \varepsilon^2} \right)^{1/2}, \quad (1)$$

где  $\Gamma$  – ширина запрещенного перехода,  $\varepsilon$  – разница отстроек сильного и пробного полей от резонанса со смежными переходами,  $D$  – коэффициент диффузии в пространстве скоростей. Такое разительное отличие от обычного лорентцевского контура, который наблюдается в бездиффузионном случае, должно проявляться в трехуровневом ионном лазере. Однако прямого экспериментального исследования эффекта до настоящего времени не было. Косвенное измерение выполнено в работе [6], где наблюдалась совместная генерация линий  $\text{ArII}$  – 488 и 514 нм, отвечающих смежным переходам с общим нижним уровнем. Ширина резонанса оказалась примерно вдвое больше, чем однородная ширина линии. В то же время диагностика ионной плотности в плазме

<sup>1)</sup>e-mail: Shapiro@iae.nsk.su

не проводилась, что затрудняло интерпретацию результатов. Авторы отнесли наблюдаемое отличие к штарковскому уширению.

В настоящей работе для проверки теории диффузионного контура НИЭФ использован зеemanовский одномодовый ионный лазер, в котором частота поля фиксирована, а уровни смещаются магнитным полем [7]. Двухфотонные переходы могут идти между магнитными подуровнями двухуровневой системы. Кроме того, параллельная независимая диагностика плазмы позволяет интерпретировать результаты с большей определенностью. Магнитооптические эффекты в многомодовом ионном лазере исследовались в [8, 9], однако узкие резонансы не выделялись и кулоновская диффузия не учитывалась.

1. Теоретическая модель. Рассмотрим случай взаимодействия линейно поляризованного излучения с переходом частицы  $m-n$ . Известно, что включение внешнего продольного магнитного поля  $H$  соответствует перестройке переходов без изменения проекции  $M$  углового момента  $J$  ( $\Delta M = 0$ ) в переходы  $\Delta M = \pm 1$ . Будем рассматривать системы уровней с полуцелым моментом: для перехода с моментом  $J_m = J_n = 1/2$  такая перестройка не дает принципиальных изменений, см. рис.1а. Наличие уровней с большими моментами приводит к формированию двухфотонных переходов  $\Delta M = \pm 2$ . Систему  $J_m = 3/2$ ,  $J_n = 1/2$  можно представить в виде двух  $V$ -схем, где роль полей, резонансных смежным переходам играют волны со встречными круговыми поляризациями излучения. Кроме того, если вероятность спонтанного излучения  $A_{m,n}$  много меньше полной скорости распада верхнего уровня  $\Gamma_m$ , то можно рассматривать эти  $V$ -схемы независимо друг от друга.

Воспользуемся методом расчета диффузионного контура нелинейного резонанса по теории возмущений [5], где были получены выражения для работы пробной волны  $(\omega_\mu, k_\mu)$  в присутствии сильного поля  $(\omega, k)$  на смежном переходе в трехуровневой схеме  $V$ -типа, оба поля были представлены в виде бегущих волн. По аналогии выписываем систему уравнений для матрицы плотности  $\rho_{ij}$  для стоячих волн в  $V$ -схеме с диффузионным интегралом столкновений:

$$S = D\Delta_v \rho_{ij}, \quad (2)$$

где  $D = \nu_{ii} v_T^2 / 2$ ,  $\nu_{ii} = 16\sqrt{\pi} N_i e^4 \Lambda / 3m_i^2 v_T^3$  - эффективная транспортная частота ион-ионных столкновений,  $N_i$ ,  $v_T$  - концентрация и тепловая скорость ионов.

В нашем случае существенным является условие точного равенства частот и волновых чисел пробного и сильного полей,  $\omega = \omega_\mu$ ,  $k = k_\mu$ . При этом соответствующие отстройки от резонансов для первой и второй  $V$ -схем (см. рис.1а) равны соответственно:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \Omega_0 + \frac{\mu_B H}{\hbar} ((g_m - g_n)/2 + g_m), & \Omega_{\mu 1} &= \Omega_0 + \frac{\mu_B H}{\hbar} ((g_m - g_n)/2 - g_m), \\ \Omega_2 &= \Omega_0 - \frac{\mu_B H}{\hbar} ((g_m - g_n)/2 - g_m), & \Omega_{\mu 2} &= \Omega_0 - \frac{\mu_B H}{\hbar} ((g_m - g_n)/2 + g_m), \end{aligned}$$

где  $\Omega_0 = \omega - \omega_0$ ,  $\omega_0$  - боровская частота перехода,  $g_j$  - фактор Ланде верхнего  $m$  и нижнего  $n$  уровней соответственно,  $\mu_B$  - магнетон Бора.

Матричные элементы дипольного взаимодействия светового поля с соответствующими переходами  $|G(J_m, M_m \rightarrow J_n, M_n)| = \left| \left( E d(J_m, M_m \rightarrow J_n, M_n) \right) / (2\hbar) \right|$ , где  $E$  - напряженность электрического поля,  $d(J_m, M_m \rightarrow J_n, M_n)$  - матричный

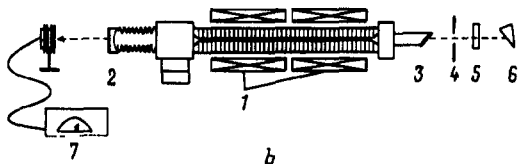
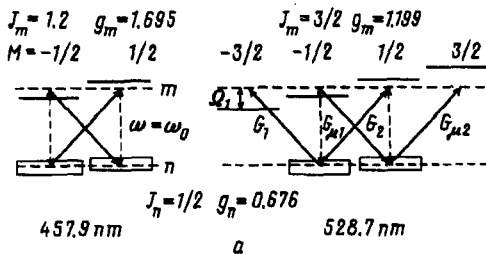


Рис.1

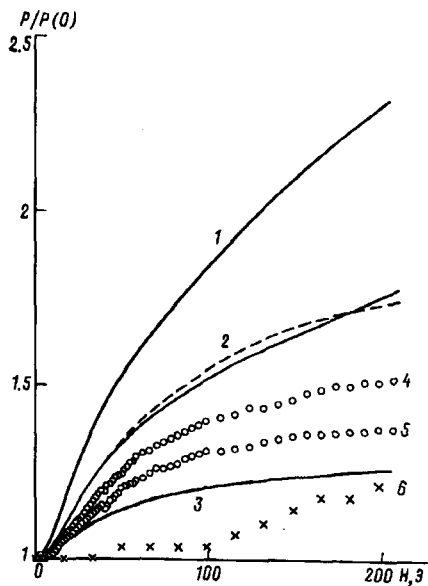


Рис.2

Рис.1. *a* – Схема переходов между магнитными подуровнями для линий 457.9 нм и 528.7 нм. *b* – Схема экспериментальной установки

Рис.2. Расчетные кривые для мощности генерации одномодового зеемановского лазера в зависимости от магнитного поля при  $\Omega_0 = 0$ ,  $\Gamma_m/\Gamma_n = 0.1$  и различных значений диффузионного параметра  $p = Dk^2/\Gamma_n^3 = 0(1); 0.35(2); \infty(3)$ . Сплошная и штриховая кривые построены с помощью численного расчета интегралов (4) и приближений аналитической формулы (5) соответственно. Экспериментальные значения для линии 528.7 нм при различных значениях превышения  $X = 1.3(4); 1.5(5)$  и для линии 457.9 нм при  $X = 1.3(6)$

элемент дипольного момента, обозначим как  $G_1, G_{\mu 1}, G_2, G_{\mu 2}$ , (см. рис. 1). Учитывая соотношения дипольных моментов для магнитных подуровней перехода  $3/2 \rightarrow 1/2$ , получим:  $|G_1|/|G_{\mu 1}| = |G_{\mu 2}|/|G_2| = \sqrt{3}$ ,  $|G_1| = |G_{\mu 2}|$ ,  $|G_{\mu 1}| = |G_2|$ .

Вычисляем работу поля стоячей волны по теории возмущений по полям  $G_j, G_{\mu j}$  для отдельной V-схемы, в отличие от [5]  $G_j$  и  $G_{\mu j}$  считаем величинами одного порядка. Для оптически тонкой среды суммарную по двум V-схемам работу поля приравняем потерям  $\rho$  за полный обход резонатора. В итоге для мощности генерации получим

$$P = ts \frac{2\pi^2 c \hbar}{\lambda^3 A_{mn}} \frac{16\Gamma_n^2}{3} \left( \frac{2g_0 l}{\rho} - 1 \right) f(H)^{-1}, \quad (3)$$

где  $g_0$  – ненасыщенный коэффициент усиления,  $l$  – длина активной среды,  $t$  – пропускание зеркала,  $s$  – сечение пучка, функция  $f(H)$  выражается через однократные интегралы:

$$f(H) = \int_0^\infty dy \exp \left( -\frac{2\Gamma_{mn}}{\Gamma_n} y - \frac{2}{3} p y^3 \right) \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[ \left( \frac{1}{1+py^2} + \frac{1}{\Gamma_m/\Gamma_n + py^2} \right) \left( \frac{1}{3} \cos^2 \left( \frac{\Omega_{\mu 1}}{\Gamma_n} y \right) + 3 \cos^2 \left( \frac{\Omega_{\mu 2}}{\Gamma_n} y \right) \right) + \right. \\
& \left. + \frac{1}{1+py^2} \left( \cos \left( \frac{2\Omega_o}{\Gamma_n} y \right) \cos \left( \frac{\Omega_{\mu 1} - \Omega_{\mu 2} + \Omega_1 - \Omega_2}{2\Gamma_n} y \right) + \cos \left( \frac{\varepsilon}{\Gamma_n} y \right) \right) \right] + \\
& + \operatorname{Re} \left\{ \int_0^\infty dy \frac{\exp \left( -\frac{2\Gamma_{mn}}{\Gamma_n} y - \frac{2}{3} py^3 \right)}{\left( (\Gamma_m - i\varepsilon)/\Gamma_n \right) + py^2} \left( \exp \left( i \frac{\varepsilon}{\Gamma_n} y \right) + \frac{\exp \left( i \frac{2\Omega_{\mu 1}}{\Gamma_n} y \right) + \exp \left( i \frac{2\Omega_{\mu 2}}{\Gamma_n} y \right)}{2} \right) \right\}, \quad (4)
\end{aligned}$$

где  $\varepsilon = -2 \frac{\mu_B H}{\hbar} g_m$ ,  $p = Dk^2/\Gamma_n^3$  - диффузионный параметр. Два интеграла соответствуют резонансу насыщения (аналог провала Лэмба при обычном сканировании частоты) и НИЭФ с учетом полевого расщепления соответственно. Асимптотическое разложение функции  $f(H)$  для больших значений  $p \geq 1$  при  $\varepsilon, \Omega_o \ll \Gamma_n$  имеет вид:

$$\begin{aligned}
f(H) = & \frac{\pi}{2\sqrt{p}} \left( \frac{10}{3} \left( 1 + \sqrt{\frac{\Gamma_n}{\Gamma_m}} \right) + 2 \right) + \\
& + \frac{\pi\sqrt{\Gamma_n}}{\sqrt{2\Gamma_m p}} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{1 + (\varepsilon/\Gamma_m)^2}}{1 + (\varepsilon/\Gamma_m)^2}} - \frac{32}{3} \cdot \frac{(2/3)^{1/3} \Gamma(2/3)}{p^{2/3}}. \quad (5)
\end{aligned}$$

Сравнение формулы (5) с результатами численного расчета суммы интегралов (4), приведено на рис.2. Зависимость  $f(H)$  имеет двухмасштабный вид. Диффузионная ширина провала Лэмба растет как  $\Gamma_n p^{1/2} \sqrt{\Gamma_n/\Gamma_m}$  и при  $p \sim 1$  в 3 раза превышает однородную. Асимптотическое разложение приводит к контуру типа корня из лорентциана для НИЭФ (второе слагаемое в (5)), который шире лорентциана с шириной  $\Gamma_m$  в 2.5 раза [5], при этом спектральная зависимость провала Лэмба пропадает, и он заменяется константой, зависящей от  $p$ , с чем и связано расхождение аналитической и численной кривых при больших отстройках. Выполненное сравнение показывает, что при  $p \geq 0.3$ , формула (5) достаточно хорошо описывает форму НИЭФ, при сильно различающихся константах релаксации уровней.

2. Эксперимент. Выбор линий для исследования НИЭФ осуществляется исходя из следующих соображений, см. рис.1а: линия 457.9 нм ( $4p^2 S_{1/2} - 4s^2 P_{1/2}$ ), единственная из линий аргонового лазера с моментом  $J_m = J_n = 1/2$ ; линия 528.7 нм ( $4p^4 D_{3/2} - 4s^2 P_{1/2}$ ) - с тем же нижним уровнем имеет угловой момент верхнего уровня 3/2 (рис.1). В данном случае условие  $A_{mn} \ll \Gamma_m$ , хорошо выполняется ( $A_{mn} = 1.4 \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}$ ,  $\Gamma_m^o = 1.7 \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}$  - радиационная константа релаксации [11]). Константа релаксации нижнего уровня  $\Gamma_n = 3 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1} \gg \Gamma_m$  [11]. В эксперименте наряду с магнитооптическим может наблюдаться магнитоплазменный эффект (МПЭ). Для усиления диффузии необходимо увеличивать концентрацию заряженных частиц, например, повышая ток разряда. При этом, благоприятным фактором является уменьшение относительного изменения  $P(H)$  из-за МПЭ с ростом тока [11], однако при большой степени ионизации следует обращать внимание на однородность

разряда и изменение концентрации нейтралов  $N_a$  в магнитном поле. Последний эффект минимизируется выбором схемы с продольным потоком газа [12]. При этом  $N_a = \text{const}$  и концентрация ионов линейно растет с током. Схема эксперимента приведена на рис.1б. Диаметр разрядного канала лазера составлял 5 мм, длина активной части 0.5 м. Рабочий ток варьировался в диапазоне 70÷100 А. Магнитное поле создавалось двухсекционным соленоидом 1. Со стороны катода располагалось зеркало с вакуумным креплением 2, со стороны анода крепилось окно Брюстера 3, диафрагма 4, эталон 5 для селекции мод и призма Литтрова 6 для селекции линии. Размер диафрагмы был существенно меньше диаметра разрядного канала. Измерителем мощности 7 регистрировалась выходная мощность лазера.

На рис.2 вместе с теорией представлены зависимости  $P(H)$  в одномодовом режиме при  $\Omega_0 = 0$  для линий 528.7 нм и 457.9 нм. Сравнение показывает, что узкий резонанс наблюдается для перехода  $3/2 \rightarrow 1/2$  и отсутствует для перехода  $1/2 \rightarrow 1/2$ . Плавный рост для линии 457.9 нм связан главным образом с широким резонансом насыщения. Вклад МПЭ проверялся в схеме многомодового лазера без поляризующих элементов (с внутренними зеркалами): для обеих линий были получены зависимости, близкие к константе, со слабым ростом при  $H \sim 200$  Э. Далее из рис.2 можно провести сравнение формы узкого резонанса с расчетом. Теоретическая кривая 2 соответствует экспериментальным условиям без подгоночных параметров. Значения коэффициента диффузии  $D = 6.6 \cdot 10^{17}$  см $\cdot$ с $^{-3}$  и константы релаксации верхнего уровня с учетом тушащих столкновений  $\Gamma_m = 4.7 \cdot 10^8$  с $^{-1}$  определялись независимо. Измерялись температура ионов  $T \simeq 1$  эВ спектроскопическим методом, концентрация электронов  $N_e = 3 \cdot 10^{14}$  см $^{-3}$  интерферометрическим методом [13], ненасыщенный коэффициент усиления  $g_0 = 6 \cdot 10^{-4}$  см $^{-1}$  и интенсивность насыщения  $I_s \propto \Gamma_m \cdot \nu T = 6.3$  кВт/см $^2$ , что позволяет вычислить константу релаксации  $\Gamma_m$  и превышение усиления над потерями  $X = 2g_0 l / \rho$ .

3. Обсуждение результатов. Представленные на рис.2 экспериментальные зависимости  $P(H)$  в одномодовом режиме близки по форме к расчетным в диффузионном приближении. Расчет без учета диффузии дает принципиально другой вид зависимости: узкий резонанс имеет большую амплитуду, отсутствие уширения провала Лэмба обуславливает резкий рост при больших полях. Отметим, что эксперимент проводился при сравнительно высоких превышениях над порогом, поскольку при  $X - 1 \ll 1$  наблюдалось искажающее форму влияние магнитного поля на параметр  $X$ . Такое влияние может быть обусловлено как изменением  $g_0(H)$  из-за МПЭ, так и изменением потерь  $\rho(H)$  (из-за поляризационных, линзовых эффектов и т.п., см., например, [4]). В рамках теории возмущений резонанс  $f(H)$  не зависит от превышения  $X$ , однако в эксперименте зависимость наблюдается уже при  $X \geq 1.3$ . Отмеченная в [5] корневая зависимость амплитуды НИЭФ  $p^{-1/2}$  при нормировке на значение мощности при нулевой отстройке  $P(0) \sim p^{-1/2}$  (см. формулу (??)) практически исчезает. В условиях эксперимента параметр  $p$  варьировался на 30%, что влияет на глубину резонанса гораздо слабее, чем изменения превышения над порогом.

Таким образом, в работе зарегистрирован НИЭФ в зеемановском одномодовом ионном лазере. Показано, что форма НИЭФ резонанса определяется диффузией в пространстве скоростей, построенная диффузионная модель

достаточно хорошо согласуется с экспериментом с точностью до поправок, связанных с полевым уширением.

Авторы выражают благодарность А.М.Шалагину за полезные обсуждения. Настоящая работа частично поддержана РФФИ (грант 96-02-19052) и МНТП "Оптика. Лазерная физика".

- 
1. Г.И.Смирнов, Д.А.Шапиро, ЖЭТФ **76**, 2084 (1979).
  2. М.И.Дьяконов, ЖЭТФ **49**, 1169 (1965).
  3. А.Ф.Кольченко, Г.И.Смирнов, ЖЭТФ **71**, 925 (1976).
  4. S.A.Babin and D.A.Shapiro, Phys. Rep. **241**, 119 (1994).
  5. С.Г.Раутиан, Д.А.Шапиро, ЖЭТФ **94**, 110 (1988).
  6. В.В.Лебедева, А.И.Одинцов, Н.А.Главатских и др., ЖПС **41**, 385 (1984).
  7. М.И.Дьяконов, В.И.Перель, ЖЭТФ **50**, 488 (1966).
  8. Г.Н.Алферов, В.П.Драчев, В.К.Мезенцев, Г.И.Смирнов, Квант. электрон. **16**, 945 (1989).
  9. G.Moguzzi, F.Strumia, and N.Beverini, In *Hanle effect and level crossing spectroscopy*, Plenum Publ.Co: New York - London, chapt.VI, 1990.
  10. В.Ф.Луукен, Physica **60**, 447 (1972).
  11. А.А.Аполонский, С.А.Бабин, В.И.Донин, А.В.Никонов, Квант. электрон. **15**, 922 (1988).
  12. С.А.Бабин, Т.Ю.Еременко, М.А.Кондратенко, А.Е.Куклин, Квант. электрон. **23**, 518 (1996).
  13. Г.И.Алферов, С.А.Бабин, В.П.Драчев, Оптика и спектроскопия **63**, 348 (1987).